## SrTiO₃(100)-(V13×V13)-R33.7° 再構成表面の NC-AFM 観察

## NC-AFM study of a SrTiO<sub>3</sub>(100)-(√13×√13)-R33.7° reconstructed surface

東工大物質理工<sup>1</sup>,東大新領域<sup>2</sup>,東北大AIMR<sup>3</sup>,阪大基礎工<sup>4</sup>,阪大産研<sup>5</sup> <sup>•</sup>清水亮太<sup>1</sup>,杉本宜昭<sup>2</sup>,赤木和人<sup>3</sup>,阿部真之<sup>4</sup>,森田清三<sup>5</sup>,一杉太郎<sup>1,3</sup> Tokyo Tech<sup>1</sup>, Univ. Tokyo,<sup>2</sup> Tohoku Univ.<sup>3</sup>, Osaka Univ.<sup>4,5</sup> <sup>•</sup>R. Shimizu<sup>1</sup>, Y. Sugimoto<sup>2</sup>, K. Akagi<sup>3</sup>, M. Abe<sup>4</sup>, S. Morita<sup>5</sup>, and T. Hitosugi<sup>1,3</sup>

E-mail: shimizu.r.af@m.titech.ac.jp

[序]: ペロブスカイト系遷移金属酸化物は多彩な物性を示すことから,高品質薄膜成長技術によるデバイス応用が期待されている.そのエピタキシャル成長用の基板として,ステップ-テラス構造及び面内方向にも原子レベルの秩序をもつSrTiO<sub>3</sub>(100)-(√13×√13)-R33.7°(以下,(√13×√13))再構成表面を用いることにより,薄膜成長初期過程の原子スケール観察を実現してきた[1,2].出発点となる(√13×√13)再構成表面の構造については,透過電子顕微鏡[3]や走査トンネル顕微鏡/分光法(STM/STS)[4]の手法により,バルクカットしたTiO<sub>2</sub>終端面上に余剰のTiO<sub>2</sub>層が並ぶ「TiO<sub>2</sub>二重層モデル(図1)」が提唱されている[3,4].このようなatomically-definedな遷移金属酸化物表面の報告は少なく,非接触原子間力顕微鏡(NC-AFM)観察例は乏しい.そこで本研究では,SrTiO<sub>3</sub>(100)-(√13×√13)再構成表面上にてNC-AFM観察を行い,表面原子構造及び遷移金属酸化物表面におけるNC-AFMの解像メカニズムについて報告する.

[実験]: サンプルには信光社製のNbドープ(0.1 at%)したSrTiO<sub>3</sub>(100)ステップ基板を使用し,超高真空中での抵抗加熱により,(√13×√13)再構成表面を作製した[1,4]. 放冷後,大気非曝露かつ室温にて光干渉計を用いたSiカンチレバーによるNC-AFM測定を行った.

[結果]: NC-AFM測定では3種類(Type I, II, III)の像を得た. Type IとType IIはSTM像に類似した(√13×√13)格 子像を有し,互いにコントラストが反転していたことから,探針先端の極性によって像が反転したものと 考えられる.一方で,Type IIIはSTM像では見られなかった内部構造を有しており(図2),暗い部分が最表 面に存在するTi<sup>4+</sup>列に一致することから,表面酸素との相互作用に起因した力を観測していることがわか った.この内部構造は探針先端の極性だけでは説明できないため,-OH終端探針モデルを用いて計算を行 ったところ,最表面O<sup>2-</sup>イオンと探針先端のH原子間の水素結合が重要な役割を担うことを見出した.この ようにNC-AFM測定を用いることで,STMでは困難な酸素アニオンの構造情報を取得できることから,真 に原子レベルでの基板表面の理解が進み,酸化物エレクトロニクスの発展に寄与できる.



Figures: (left) A proposed structural model of the SrTiO<sub>3</sub>(100)-( $\sqrt{13} \times \sqrt{13}$ ) surface [3,4]. (right) An NC-AFM image obtained by type III (OH-terminated) tip. 7.5×7.5 nm<sup>2</sup>,  $\Delta f = -9.7$  Hz, A=8.4 nm.

## 参考文献

[1]: Shimizu *et al.*, ACS Nano 5, 7956 (2011).
[2]: Ohsawa, Shimizu *et al.*, ACS Nano 9, 8766 (2015).
[3]: Kienzle et al., Phys. Rev. Lett. 106, 176102 (2011)
[4]: Hamada, Shimizu *et al.*, J. Am. Chem. Soc. 136, 17201 (2014).